

TO
POK

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定格	使用温度範囲	-55℃～85℃(注1)			保存温度範囲	-10℃～60℃(注2)			
	電圧	AC 125 V			使用湿度範囲	40%～80%			
	電流	0.5 A			保存湿度範囲	40%～70%(注2)			
性能									
	項目	試験方法			規格		QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○	
	表示	目視にて確認する。					○	○	
電気的 性能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。			45 mΩ以下		○	—	
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で 測定する。			55 mΩ以下		○	—	
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。			100 MΩ以上		○	—	
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—	
機械的 性能	繰返し動作	500 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐振性	周波数 10～55 Hz、全振幅 1.52 mm、 3 方向各 2 時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3方向各 3 回試験する。					○	—	
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上		○	—	
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→10→15→30→10→15 分 を 5 サイクル試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	塩水噴霧	濃度 5% の塩水、48 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下		○	—	
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。		○	—	
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間			外観の変形及び端子などに著しい ガタのないこと。		○	—	
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内					○	—	
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。		○	—	
備考									
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。					製図 HIF 04.03.18 鈴木	担当 HIF 04.3.18 中村	検図 HIF 04.3.18 山口	承認 HIF 04.3.18 大川	出図
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。									
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目									
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					製品規格表		製品名 FX2C2-**P-1.27DSA(71)		
旧CL CL			図番 SLC4-083049-21		製品コード CL572			1 1	